Systém rastrovacej sondovej mikroskopie (SPM): Agilent 5500 AFM

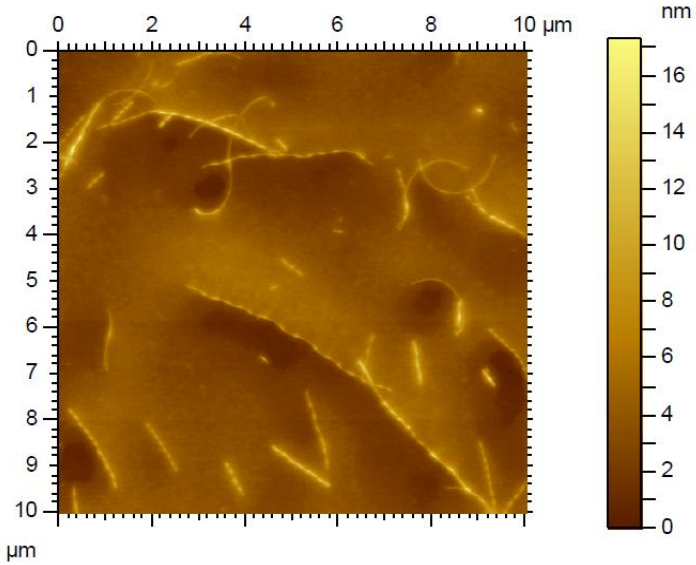
Oddelenie fyziky magnetických javov, ÚEF SAV, Watsonova 47

SPM systém zahŕňajúci STM a AFM podporuje tieto základné **meracie módy**:

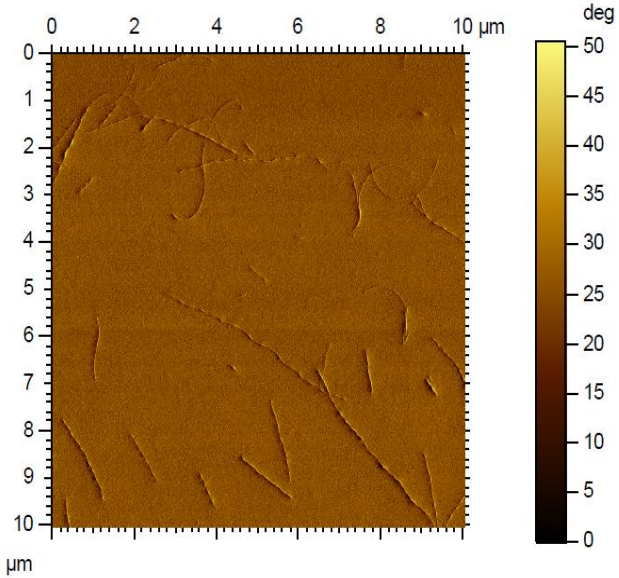
- kontaktný
- semikontaktný
- nekontaktný
- zobrazovanie fázy
- režim bočných síl

a pokrokové módy:

- MFM (Magnetic)
- EFM (Electric)
- KFM (Kelvin)
- PFM (Piezo)



Obr. 1a) Fibrily na sľude, topografia (tapping mód).



Obr. 1b) Fibrily na sľude, zobrazenie fázy v tapping móde

Popri meraniach v bežných podmienkach (izbová teplota, vzduch) systém umožňuje realizovať:

- AFM merania v ochranných atmosférach (v enviromentálnej komore a v glove boxe)
- AFM pozorovania objektov v kvapalinách, pričom kvapalina môže byť v komore uzavretá trvale, alebo môže cez ňu prúdiť
- Realizácie meraní v teplotnom intervale pri teploty okolia od -30°C do 250°C

zodpovedný: I. Baťko, batko@saske.sk